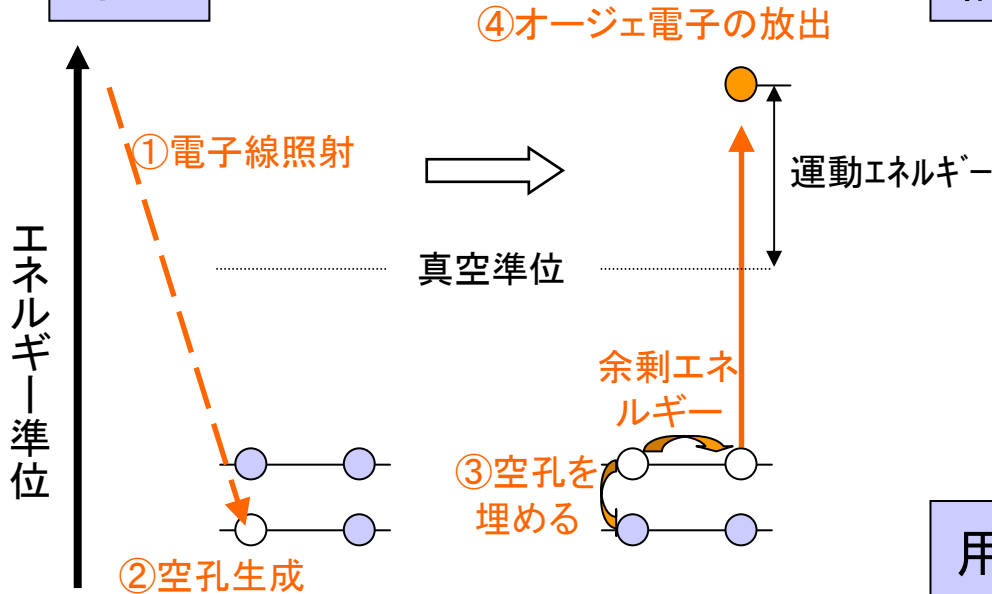
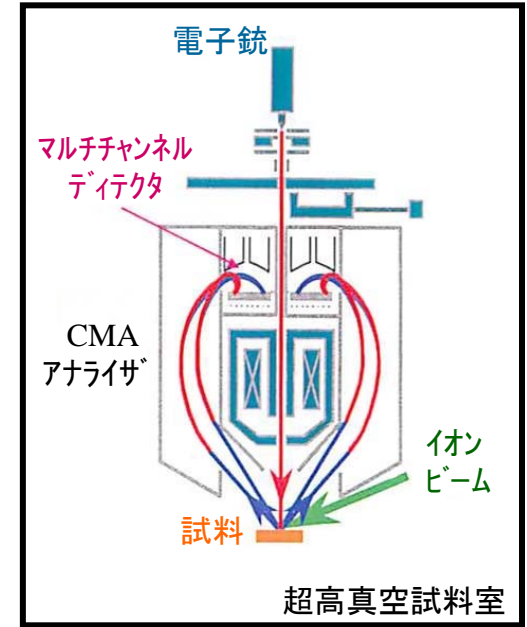


AES:オージェ電子分光 (Auger Electron Spectroscopy)

原理

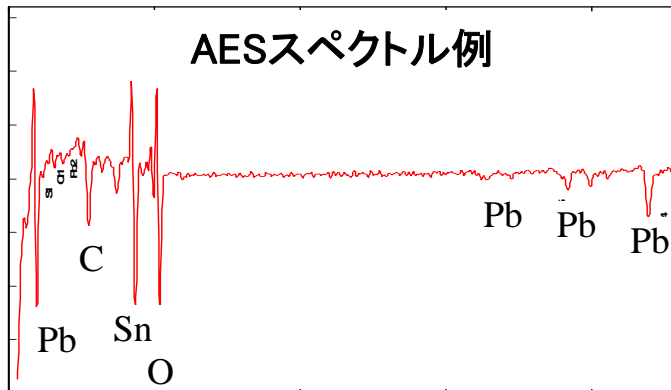


構成



用途

- ・固体(導電物)表面の定性半定量分析
- ・微小部分分析
- ・深さ方向組成分析

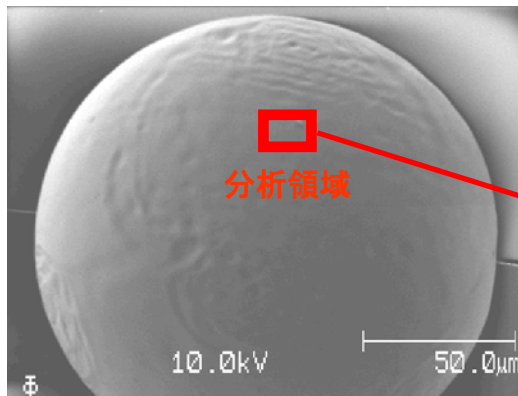


→ 電子の運動エネルギー

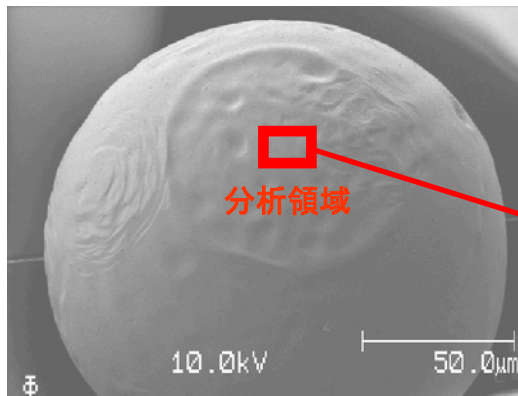
検出限界	~1at%
検出深さ	数nm
最小電子線径	10nm

AES分析事例

二次電子像

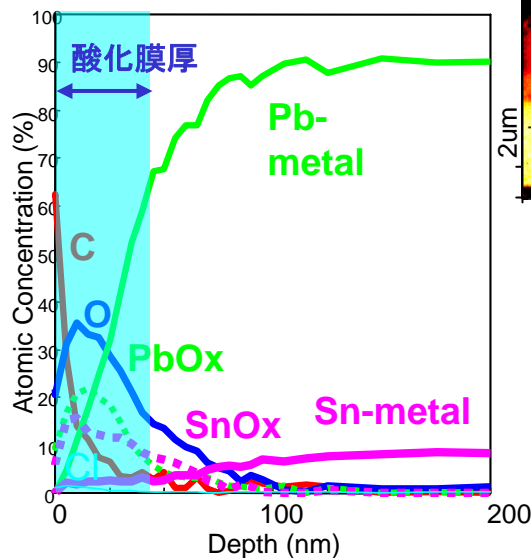
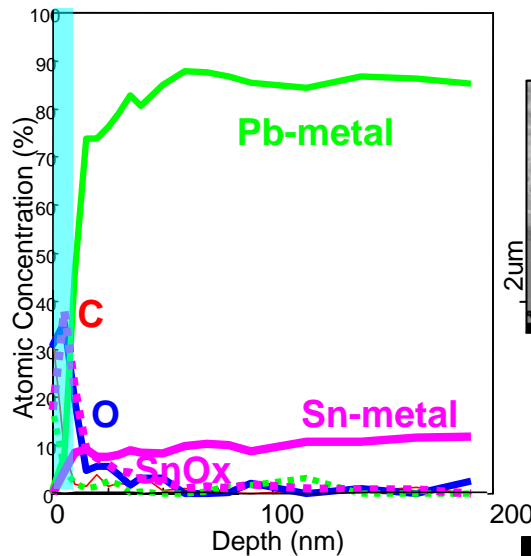


真ん丸いバンプ

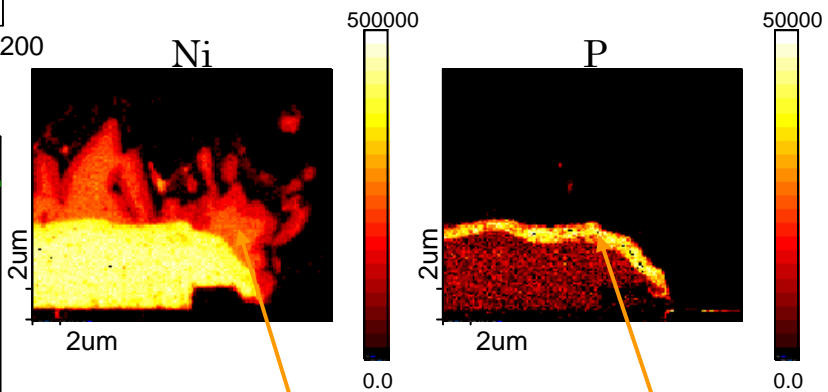
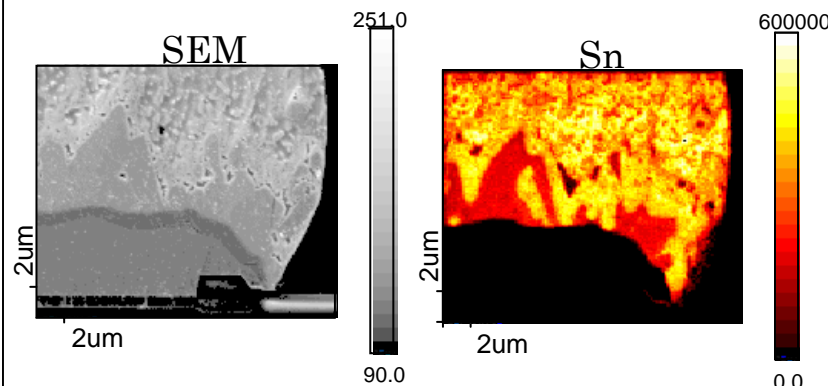


窪んだバンプ

深さ方向分析



元素マップ分析



Sn(スズ)-Ni(ニッケル)合金層の形成

P(リン)の偏析

バンプの断面